КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ Кафедра физики твердого тела

Ф.Г. ВАГИЗОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ НАВЕСКИ ОБРАЗЦА ДЛЯ МЁССБАУЭРОВСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Казань – 2024

УДК 543.429.3

Принято на заседании учебно-методической комиссии Института физики Протокол № 9 от 29 мая 2024 года

Рецензент:

доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник КФТИ им. Е.К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН **Р.Н. Шахмуратов**

Вагизов Ф.Г. Определение оптимальной навески образца для мёссбауэровских измерений / Ф.Г. Вагизов. – Казань: Казанский федеральный университет, 2024. – 17 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов Института физики КФУ, приступивших к изучению основ гамма-резонансной (мёссбауэровской) спектроскопии и выполнению лабораторных работ, предусмотренных учебной программой таких курсов как: «Физические методы исследования конденсированных сред» и «Ядерно-физические методы исследования твердых тел». В пособии приводится обоснование наиболее популярного критерия оптимальной навески и аналитическое выражение для расчета соотношения сигнал/шум для мёссбауэровских спектров со сверхтонкой структурой, соответствующей монопольному электростатическому взаимодействию, квадрупольному взаимодействию ядра с градиентом электрического поля и взаимодействию магнитного момента ядра с магнитным полем на ядре. В приложении приведена таблица коэффициентов поглощения резонансного γ-излучения для наиболее часто используемых мёссбауэровских нуклидов. Данное пособие не является оригинальным и полностью основано на известных учебниках и публикациях, приведенных в разделе «Литература».

© Вагизов Ф.Г., 2024 © Казанский федеральный университет, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Цель лабораторной работы	4
Теоретические основы метода определения оптимальной навески	4
Критерий оптимального выбора навески образца	5
Определение оптимальной навески образца	8
Выполнение лабораторной работы	10
Вопросы для самоконтроля	11
Приложение. Коэффициенты поглощения резонансного ү-излучения для	14
наиболее часто используемых мёссбауэровских нуклидов	
Литература	16

Введение

В геометрии пропускания мёссбауэровский спектр представляет собой зависимость числа зарегистрированных резонансных γ -квантов от скорости движения мёссбауэровского источника относительно поглотителя. Приготовление поглотителя и выбор оптимальной навески образца играют важную роль при проведении измерений на пропускание с помощью гамма-резонансной спектроскопии. Эффективная толщина резонансного поглотителя существенно влияет на качество экспериментального спектра и на время его накопления, и поэтому необходимо выбрать оптимальную навеску поглотителя (масса исследуемого соединения на единицу его площади).

Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с критерием выбора оптимальной навески образца для мессбауэровских измерений на пропускание, проведение расчета оптимальной толщины поглотителя для некоторых веществ на основе приведеннго в пособии метода определения оптимальной навески.

Теоретические основы метода определения оптимальной навески

Под оптимальной толщиной поглотителя d_{opt} мы будем понимать ту толщину поглотителя, которая при измерениях гамма-резонансных спектров приводит к минимальному статистическому разбросу при данной продолжительности набора экспериментального спектра, что позволяет определять спектральные параметры с лучшей точностью.

При малой толщине поглотителя образец будет содержать малое количество мессбауэровских ядер, а спектральная интенсивность резонансных линий поглощения будет слабой на большом уровне фона нерезонансных отчетов, приводя к большому статистическому разбросу экспериментальных данных и затрудняя получение точных значений сверхтонких параметров спектров. Слишком большая

4

толщина поглотителя приводит к уменьшению доли регистрируемых резонансных γ-фотонов по сравнению с фоновым излучением, приводя к заметной трансформации и уширению пика резонансного поглощения (из-за сильного поглощения в резонансной области детектор регистрирует преимущественно γ-кванты с энергией, соответствующей крыльям линии излучения источника). При очень большой толщине поглотителя экспериментальное наблюдение эффекта Мессбауэра может быть сильно затруднено, и даже не возможно. Поэтому, чтобы достичь условия, благоприятного для эксперимента, необходимо выбрать оптимальную навеску образца.

Во многих мессбауэровских исследованиях по изучению динамики решетки, фазовому анализу, по изучению валентности и распределению мессбауэровских ионов по неэквивалентным позициям решетки необходимо определение интенсивности поглощения парциальных спектров с большой точностью. Эти задачи требуют наличия высококачественных экспериментальных мессбауэровских спектров, что возможно только при использовании наиболее оптимальных навесок исследуемых соединений. После открытия эффекта Мессбауэра был публикован ряд теоретических и экспериментальных работ по определению оптимальной толщины мессбауэровских поглотителей [1-3]. Однако следует заметить, что до сих пор нет универсального метода по определению оптимальной толщины из-за многообразия изучаемых объектов и отсутствия глубокого понимания всех процессов взаимодействия резонансного γ-излучения с составными элементами исследуемых соединений и структуры вещества. Поэтому выдвигаемые методы надо рассматривать как приближенные оценки оптимальной толщины d_{оп}.

Критерий оптимального выбора навески образца

Для выбора оптимальной толщины мы, прежде всего, должны выбрать физические параметры, которые могут помочь оценить, насколько та или иная толщина будет оптимальной для эксперимента. В качестве таких параметров предла-

5

гались использовать интенсивность [6] или площадь [7] спектральной линии. Ряд исследователей предлагали использовать критерий сигнал/шум, S/N [8-12]. В настоящее время наиболее часто используемым критерием является именно критерий сигнал/шум [8], или, другими словами, фактор качества Q (quality factor) [11], который определяется следующим выражением:

$$Q = \frac{S}{N} = \frac{I(\infty, d) - I(v_r, d)}{\left[\left(\Delta I(\infty, d)\right)^2 + \left(\Delta I(v_r, d)\right)^2\right]^{1/2}} = \frac{I(\infty, d) - I(v_r, d)}{\left[I(\infty, d) + I(v_r, d)\right]^{1/2}},$$
(1)

где $I(\infty,d)$ и $I(v_r,d)$ – число зарегистрированных γ -квантов вне резонанса и при резонансе, соответственно (см. рис. 1), ΔI - обозначает статистическую ошибку измерения *I*, причем $\Delta I = \sqrt{I}$, поскольку это случайный процесс.



Рис. 1. Парциальные вклады в мёссбауэровский спектр на пропускание.

Для тонкого образца различие между $I(\infty,d)$ и $I(v_r,d)$ маленькое, часто меньше чем 10% от числа зарегистрированных γ -квантов вне резонанса. Тогда можно предположить, что $I(\infty,d) + I(v_r,d) \cong 2I(\infty,d)$. Следовательно, мы можем переписать выражение Q в более простом виде [9, 13]:

$$Q = \frac{S}{N} = \frac{I(\infty, d) - I(v_r, d)}{[I(\infty, d)]^{1/2}}$$

= $f_s I_0^{1/2} e^{-\mu_a d/2} [1 - e^{-\mu_r d/2} J_0(i\mu_r d/2)]_{,}$ (2)
= $f_s I_0^{1/2} F(\mu_a, \mu_r, d)$

где I_0 есть полная интенсивность падающего γ -излучения, f_s - фактор Лэмба-Мессбауэра источника, d- толщина поглотителя в единицах mg·cm⁻² (заметим, что $\mu_r d = t_a$ есть эффективная мессбауэровская толщина), J_0 - функция Бесселя нулевого порядка, μ_a (в единицах cm²·mg⁻¹) – массовый коэффициент поглощения, и μ_r (тоже в единицах cm²·mg⁻¹) – коэффициент резонансного поглощения. Как μ_a , так и μ_r определяются следующим образом:

$$\mu_a = \sum_i p_i \mu_a^i \,, \tag{3}$$

$$\mu_r = r\sigma_0 f a_m \frac{N_A}{A_m} n_0, \qquad (4)$$

где p_i – массовая доля *i*-го элемента в образце, σ_0 – поперечное сечение резонансного поглощения, α_m – естественная распространенность мессбауэровского изотопа (для ⁵⁷Fe $\alpha_m = 0.0219$). N_A – число Авогадро, A_m – молекулярная масса (mg) вещества в 1 моле, n_0 – число мессбауэровских атомов в молекуле изучаемого соединения (например для Fe₃BO₆ это число равно $n_0 = 3$), и f – фактор Лэмба-Мёссбауэра поглотителя.

Весовой коэффициент r в выражении (4) учитывает распределение интенсивностей линий в сверхтонкой структуре мессбауэровского спектра. Когда спектр поглощения представляет одиночную линию, r = 1. В случае наблюдения в спектре поликристаллического образца квадрупольного расщепления, когда интенсивности линий в дублете имеют равные значения и при вычислении $I(v_r, d)$ для одной линии в выражении (2) используется эффективная толщина $t_a/2$, следовательно, для этого случая r = 1/2. При наличии сверхтонкого магнитного расщепления ядерных подуровней (как например в α -Fe₂O₃ или α -Fe), мы вычисляем $I(v_r,d)$ для 3-ей или 4-ой линии, где эффект насыщения минимален. Если используется поликристаллический образец, то эффективная толщина для линий 3 и 4 будет определяться как равной $t_a/12$, поэтому в этом случае r = 1/12. Такое же значение можно использовать и для магнитно-упорядоченных монокристаллов.

Мы можем переписать выражение (2) таким образом:

$$Q = \frac{I(\infty, d) - I(v_r, d)}{I(\infty, d)} \cdot \sqrt{I(\infty, d)} = \varepsilon(v) \cdot \frac{1}{\sqrt{I(\infty, d)}},$$
(5)

где $1/\sqrt{I(\infty,d)}$ – обратная величина стандартной статистической ошибки фоновых отсчетов, $I(\infty,d)$, которая часто используется в статистических измерениях случайных процессов как индекс точности, а $\varepsilon(v)$ дается следующим выражением:

$$\varepsilon(v) = \frac{I(\infty, d) - I(v, d)}{I(\infty, d)} = f_s[1 - T(v)], \tag{6}$$

где

$$T(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Im(E - \frac{v}{c} E_0) \cdot A(E) dE .$$
 (6a)

T(v) – интеграл прохождения (transmission integral), $\Im(E - \frac{v}{c}E_0)$ – функция Лорен-

ца.

$$A(E) = e^{-\mu_r(E)d} = e^{-\sigma(E)\cdot t_a},$$

$$\sigma(E) = \sigma_a(E) / \sigma_0,$$

$$t_a = n_a f \sigma_0 d.$$
(66)

Выражение (2) является общим определением отношения сигнал/шум, но из преобразованного выражения (5) лучше видна физическая сущность этого параметра. Лучший коэффициент качества *Q* требует лучшей комбинации двух параметров, т.е. большего эффекта и лучшей точности в измерениях.

Определение оптимальной навески образца

Предположим, что $f_s |\sqrt{I_0}| = c$ (постоянная), введем параметры $\mu_a d = x$ и $\mu_r \mu_a = b$, тогда выражение (2) можно записать таким образом:

$$Q(b,x) = c \cdot e^{-x/2} \left[1 - e^{-bx/2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} (\frac{bx}{4})^{2k}\right] = cF(b,x),$$
(7)

где

$$F(b,x) = e^{-\frac{x}{2}} \left[1 - e^{-\frac{bx}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} \left(\frac{bx}{4}\right)^{2k}\right].$$
(8)

Теперь мы можем учитывать *b* как параметр и построить/протабулировать F(b,x), (который пропорционален коэффициенту качества Q(b,x)) для различных значений *b*, как это показано на рис. 2. Для каждого *b* кривая F(b,x) имеет максимум, и по значению $x = \mu_a d$, для которого наблюдается максимум, мы можем определить оп-



Рис. 2. Зависимость F(b,x) от *x* при различных значениях *b*.

тимальное произведение $\mu_a d_{\text{opt}}$, т.е. оптимальную толщину $d_{\text{opt}} = x_{\text{max}}/\mu_a$.

Значение μ_a для исследуемого соединения можно вычислить, зная химическую формулу и коэффициенты поглощения для резонансного γ -излучения каждого составного элемента вещества. Для определения $b = \mu_r / \mu_a$ необходимо знание фактора Лэмба-Мессбауэра f_a исследуемого вещества, что для вновь исследуемых соединений бывает, как правило, неизвестным, и требует экспериментальной оценки. Существуют несколько экспериментальных методов по определению фактора Лэмба-Мессбауэра [14]. Наиболее популярный из них – это использование образцов с разной навеской, что дает возможность определить f_a исследуемого вещества с довольно хорошей точностью и вычислить значение μ_r . Значения фактора Лэмба-Мессбауэра для некоторых соединений приведены в таблице.

Таблица

	Материал	<i>f</i> _a (295K)	Оптимальная навеска,
			мг/см ²
1	$Fe(C_5H_5)_2$	0.08	
2	Cu ₅ FeS ₄	0.77	
3	FeSO ₄ ·7H ₂ O	0.16	
4	SNP,	0.37	
	Na ₂ [Fe(CN ₅)NO]		
5	K ₃ Fe(CN) ₆	0.10	
6	K_4 Fe(CN) ₆ ·3H ₂ O	0.25	
7	α-Fe ₂ O ₃	0.65	
8	α-Fe	0.75	
9	FeS ₂	0.20	
10	α-FeOOH	0.50	
11	Fe ₃ O ₄	0.58	
12	SnO ₂	0.28	
13	BaSnO ₃	0.57	

Значения фактора Лэмба-Мессбауэра для некоторых соединений

Выполнение лабораторной работы – «Определение оптимальной навески образца для мёссбауэровских измерений».

- 1. Используя описанный выше метод, определить оптимальную навеску (мг/см²) для соединения, указанного преподавателем (см. таблицу). Для расчета оптимальной навески необходимо вычислить: A_m молекулярную массу (mg) вещества в 1 моле, n_0 число мессбауэровских атомов в молекуле изучаемого соединения. Определить α_m естественную распространенность мессбауэровском спектре (r = 1 для синглета, $r = \frac{1}{2}$ для дублета, $r = \frac{1}{12}$ для секстета). Для вычисления μ_a использовать коэффициенты поглощения для γ -излучения с энергией 14.4, 21.83 и 23.87 кэВ для мёссбауэровских нуклидов ⁵⁷Fe, ¹⁵¹Eu и ¹¹⁹Sn, соответственно. Эти данные приведены в Приложении 1.
- 2. Измерить диаметр поперечного сечения кюветы, которая будет использоваться для мёссбауэровских измерений. Определить массу образца, соответствующую оптимальной навеске для кюветы данного сечения. Растолочь образец в агатовой ступке и заполнить кювету измельченным порошком с размером частиц не более 10-50 микрон. Слегка придавливая, закрыть кювету крышкой, чтобы порошок заполнил объем кюветы в виде тонкого слоя с однородной толщиной. Проверить наличие незаполненных участков кюветы, рассматривая кювету на просвет. Закрепить подготовленный для измерений образец на держатель образца мёссбауэровского спектрометра.
- Сравнить соотношение сигнал/шум для измерений, сделанных при оптимальной навеске и при навесках в 2 раза больше и в два раза меньше оптимального.
 t_{изм} = const.

11

Вопросы для самоконтроля

- 1. Какие процессы приводят к ослаблению мессбауэровского гамма излучения при прохождении среды, содержащей резонансные ядра?
- Вычислить коэффициент ослабления для каждого процесса и сравнить их при условии, что энергия фотонов мёссбауэровского излучения равна 14.4 кэВ, а среда представляет собой фольгу металлического железа.
- 3. В чем недостаток использования в мёссбауэровских измерениях очень тонких и очень толстых образцов?
- 4. Какие параметры могли быть выбраны для определения оптимальной навески образцов в мёссбауэровских измерениях?
- 5. Какой формулой определяется критерий сигнал/шум?
- 6. Как определяется массовый коэффициент поглощения µ_a в многоэлементных соединениях?
- 7. От каких факторов зависит коэффициент резонансного поглощения μ_r ?
- 8. Что учитывает весовой коэффициент *r*? Привести численные значения весового коэффициента *r*, когда ядра исследуемого соединения испытывают только монопольное электростатическое взаимодействие, только квадрупольное взаимодействие и только сверхтонкое магнитное взаимодействие.
- Как определяется эффективная мессбауэровская толщина? Привести формулу.
- Какую форму имеет функция Q(b,x) коэффициент качества? Привести формулу и нарисовать график.
- 11. Как определяется оптимальная толщина образца по графику функции Q(b,x)
 коэффициента качества?
- 12. В литературе в качестве первого шага при подготовке образца для мессбауэровских измерений на изотопе ⁵⁷Fe рекомендуется использовать навеску 10 мг/см² для образца с естественным содержанием изотопа ⁵⁷Fe. Сравнить со-

отношение сигнал/шум Q(b,x) при одинаковом времени накопления мёссбауэровского спектра исследуемого вами материала/соединения для навески 10 мг/см² и оптимальной навески, которую вы получили на основе предложенного в пособии метода.

Коэффициенты поглощения резонансного ү-излучения для наиболее часто используемых мёссбауэровских нуклидов

Absorber	2		7-ray energy (LeY)												
Element	Ato	amic as (u)	E.0	14.41 57Fe	21.53 ¹⁵¹ Eu	23.87 ¹⁰⁰ Sn	25.66 ¹⁶¹ Cy	27.77	35.46 ¹²⁵ Te	37.15 ¹⁸¹ 5b	50	60	80	100	150
н	1	1.008	0.404	0.387	0.367	0.363	0.362	0 350	0 151	0 245	1 225	0 336	0.100	0.204	0.365
He	2	4.003	0.423	0.213	0.194	0.191	0.189	0.187	0.190	0.178	0.170	0.166	0.155	0.149	0.134
Li	3	6.941	0.945	0.227	0.182	0.174	0.171	0.167	0.158	0.156	0.149	0.144	0.135	0.129	0.155
Be	4	9.012	2.51	0.32	0.215	0.195	0.190	9.185	0.175	0.170	0.156	0.150	0.140	0.133	0.119
B	S	10.81	5.38	D.51	0.27	0.25	0.235	0.72	0.19	0.185	0.167	0.159	0.147	0.139	0.124
N		12.011	10.6	0.87	0.40	0.35	0.32	0.29	0.22	0.21	0.188	0.175	0.161	a.151	0.135
0		15.999	27.6	2.2	0.74	0.43	0.39	0.34	0.25	0.25	0.199	0.182	0.164	0.153	0.155
F	9	18.998	37.4	2.7	0.88	0.66	0.62	0.52	0.30	0.31	0.21	0.193	0165	0.155	0.130
Ne	10	20.179	54.0	4.0	1.36	1.05	0.87	0.70	0.42	0.38	0.260	0.218	0.179	0.161	0.137
Na	. 11	22.990	69.2	5.2	1.70	1.24	1.07	0.88	0.51	0.46	0.283	0.229	0.181	0.159	0.134
Mg	12	24.305	92.4	6.8	2.20	1.64	1.18	1.12	0.64	0.56	0.329	0.258	0.195	0.169	0.139
AI Si	1.5	25.962	115	9.0	2.74	2.15	1.75	1.40	0.74	0.69	0.368	0.279	0.202	0.171	0.138
p	15	10.974	177	14.9	4.15	1.7	10	1.64	0.96	0.84	0.433	0.317	0.223	0.184	0.145
S	16	32.06	210	17.0	5.6	4.0	3.6	2.2	1.08	1.30	0.49	0.35	0.23	0.19	0.143
ci	17	35.453	240	20.0	6.1	4.5	3.7	2.9	1.53	1.36	0.642	0.438	0.239	0.205	0.151
Ar	12	39.948	268	21.0	7.0	5.Z	4.2	3.4	1.7	1.5	0.69	0.463	0.276	0.205	0.143
ĸ	19	39.098	326	27.0	8.8	6.Z	5.3	4.6	2.2	1.8	0.857	0.565	0.326	0.236	0.159
Ca	20	40.08	383	32.5	10.5	7.7	6.5	5.0	Z.5	2.4	1.00	0.649	0.364	0.257	0.168
SC Ti	12	44.956	407	33	11.2	\$.3	7.1	5.6	2.7	2.4	1.07	0.683	0.373	0.257	0.162
v	23	50.941	493	43	14.1	19.6	8.8	6.2	3.0	2.5	1.19	0.735	0.40Z 0.433	0.272	0.165
													,		
Absorber			7-my en	engy (keV)											
Boment	Ab	omic ass /u1	6.9	14.41	21.53	23.87	25.66	27.77	35.46	37.15	50	60	80	100	150
						341	4			SD					
G	24	51.996	570	48	16.8	12.2	10.4	8.0	4.0	3.4	1.52	0.948	0.486	0 315	017
Mn	25	54.938	75.9	53	18.4	13.4	11.3	8.5	4.6	3.9	1.67	1.04	0571	0.324	610
Fe	26	55.847	87.1	64	22.0	15.5	12.4	10.0	5.0	4.4	1.92	119	0.545	0.334	0.10
Co	27	58.933	96.0	66	21.4	16.0	13.6	10.6	5.4	4.8	2.05	178	0679	0 190	0.30
Ni	28	58.70	110	75	26.0	18.8	15.8	12.4	6.4	5.8	7.47	1 40	0720	9.350	0.20
Cu	29	63.546	118	82	28.0	20.0	16.8	13.0	6.8	61	256	154	0.750	0.151	0.22
Zn	30	65.38	132	92	31	22	18.4	14.8	75	6.2	2.65	1.70	0074	0.433	0.22
Ga	31	69.72	141	97	32.8	23.2	19.0	15.7	80	71	1 40	1.73	0.863	0.492	0.23
Ce	32	72.59	152	102	36.0	25.0	205	16.7		74	4.75	1.61	0.662	0.511	0.2.9
As	33	74.922	168	175	385	78.0	72.0	10.0	0.4	1.0	3.21	1.93	0.921	0.543	0.247
Se	34	78.96	180	110	40	30.5	35.5	10.5	7.0	0.9	3.34	2.15	1.00	0.586	0.255
Br	35	79 964	108	130	43	37.0	17.3	19.5	10.2	9.0	3.78	2.29	1.07	0.616	0.266
Kr	16	87.90	212	134	45	34.0	27.6	21.5	11.2	9.8	4.17	2.52	1.17	0.672	0.286
Ph	17	95.449	727	71.0	10	.24.3	26.5	23.5	11.8	10.4	4.43	2.67	1.24	0.708	0.297
C.	10	07.40	251	21.0	49	37	31.0	24.8	12.6	11.4	4.81	2.91	1.34	0.761	0.315
Y	30	07.94	231	24.3	52	39.5	32.5	26.5	13.8	12.2	5.20	3.14	1.44	0.818	0.332
7.	39	00.900	2/4	26.0	58	42	33.5	28.8	15.0	13.2	5.66	3.41	1.56	0.887	0.354
ML.	40	91.11	296	28.0	62	44	38	31	16.2	14.4	6.11	3.70	1.70	0.951	0.374
ND	41	92.906	323	29.5	65	46.5	40	32.5	17.5	15.6	6.68	4.04	1.85	1.04	0.404
MD	42	95.94	343	34	69	49	42	34	18.5	16.3	7.03	4.27	1.96	1.10	0.422
IC	43	98,906	364	35.5	75	54	44	36	19.6	17.4	7.36	4.45	2.03	1.13	0.437
Ru	44	101.07	391	37.5	13.0	60	49	40	20	18.0	7.87	4.76	2.17	1.20	0456
BL.	45	102 905	418	10	175	60	51	30 E	33						

Pđ	46	106.4	447	41	14.0	10.6	56	43	71	20.4					
Ag	47	107.868	479	44	15.5	114	57	45	24.4	22.4	8.83	5.37	2.45	1.36	0.505
Cd	48	112.41	501	46	16.2	12.2	10.2	47	35.6	41.0	9.44	3.75	2.64	1.46	0.539
In	49	114.82	530	49	17.0	12.6	10.6	80	20.4	14.4	9.41	5.95	2.72	1.51	0.552
Sn	50	118.69	563	54	18.0	13.3	11.2	0.2	20.7	24.8	10.5	6.35	2.87	1.58	0.577
sb	51	121.75	579	36	16.7	14 3	177	10.1	37.5	24.0	10.8	6.60	3.00	1.65	0.594
Te	52	127.60	604	60	20.1	15 3	17.9	10.5	47.3	25.0	11.6	6.98	1.18	1.74	0.623
1	53	126.905	655	61	21.0	160	135	11.0	31	47.5	12.0	7.27	3.30	1.81	0.642
Xe	54	131.30	670	67	23.0	172	145	11.0	33	48.4	12.7	7.69	3.43	1.91	0.683
Ca	55	132.905	725	71	24.6	18.0	15.8	11.3	30	30.0	13.0	7.89	3.59	1.97	0.702
Ba	56	137.33	754	75	25.0	18.6	16.7	12.3	0.1	35.6	14.0	8.43	3.82	2.09	0.739
Le	57	138,906	672	76	26.5	20.0	170	13.2	7.0	6.1	15.1	8.68	3.94	2.16	0.763
Ce	58	140.12	511	77	20.5	22	10.0	14.0	6.5	6.0	15.1	9.19	4.20	2.30	0.811
Pr	59	140.098	543	81	20	77.0	18.0	14.8	7.1	6.5	16.3	9.80	4.43	2.41	0.847
Nd	60	144.24	201		21 2	74.0	17.4	16.0	7.6	6.8	17.3	10.4	4.70	2.56	0.893
Pm	61	145	210	87	32.4	24.0	20.2	18,4	7.8	7.0	17.8	10.8	4.38	2.66	0.931
Sm	62	150.4	721	74	34.6	29.8	21.1	17.6	8.2	7.3	18.7	11.3	5.08	2.78	0.967
Eu	63	151 06	721	100	34.3	0.0	22.0	18.8	8.6	7.6	19.4	11.7	5.29	2.88	1.00
Gd	64	157 75	778	100	35.8	28.2	22.6	18.9	8.9	8.0	20.4	12.3	5.55	3.03	1.05
Th	65	158 075	250	109	3/	27.0	23.2	19.0	9.3	8.3	3.94	12.4	5.71	3.13	1.09
Dr	66	162 50	261	110	58	28.4	24.1	19.7	9.8	8.8	4.17	13.2	5.99	3.25	1.13
He	67	164.030	173	110	40	29.8	25.0	20.4	10.4	9.2	4.30	13.7	6.19	3.37	1.16
Fr	6.9	167.75	2/3	115	42	31.4	26.4	21.5	10.8	9.6	4.53	14.3	6.46	3.52	1.21
Tm	60	169.004	201	120	44.5	33.0	27.8	22.6	11.2	10.0	4.72	14.9	6.73	3.67	1.26
1	70	172.64	239	127	45.5	34	28.9	23.3	11.8	10.6	4.92	15.6	7.02	3.81	1.32
1.	70	173.04	310	133	47	35	29.8	24.0	12.4	11.1	5.05	3.18	7.20	3.93	1.36
LIF	11	1/4.9/	324	139	48	36.5	31	24.8	12.8	11.5	5.27	3.32	7.54	4.10	1.41
TH Th	72	1/8.49	336	145	49	38	32	25.6	13.2	11.9	5.46	3.44	7.56	4.18	1.45
14 NPT	75	140.948	546	150	51.5	39	33	26.8	13.8	12.5	5.69	3.59	7.79	4.29	1.50
R.	/4	183.85	364	155	54	40	34.5	28.0	14.5	13.0	5.90	3.70	8.06	4.49	1.56
P.C.	15	186.207	\$78	160	56.5	42	35	28.5	15.0	13.6	6.14	3.85	8.70	4.72	1.62

Absorber		y-ray energy (keV)														
Element	Atomic mass (u)		6.0	14.41 ⁵⁷ Fe	21.53 ¹⁵¹ Eu	23.87 ¹¹⁹ Sn	25.66 ¹⁶¹ Dy	27.77 ¹²⁹ j	35.46 ¹²⁵ Te	37.15 ¹²¹ Sb	50	-	80	100	150	
Os	76	190.2	393	165	59	44	36	29.0	15.6	14.1	6.33	3.99	8.96	4.88	1.67	
Ir	77	192.22	407	172	61	45.5	38	31	16.4	14.6	6.61	4.17	9.31	5.04	1.73	
Pt	78	195.09	423	178	64	47	40	33	17.0	15.2	6.82	4.29	9.51	5.09	1.74	
Au	79	196.966	440	191	66.5	49.5	42	34.5	17.6	15.7	7.13	4.49	2.20	5.23	1.84	
Hg	80	200.59	456	165	67	52	44	36	18.2	16.2	7.41	4.65	2.27	5.52	1.86	
71	81	204.37	472	123	68.5	54	45	37	19.0	16.8	7.66	4.80	2.34	5.66	1.93	
Pb	82	207.2	491	120	70	56	46.5	38	19.8	17.4	7.88	4.91	2.38	5.58	1.99	
Bi	83	208.990	510	123	71.5	58	48	39.5	20.6	18.2	8.30	5.22	2.56	6.17	2.09	
Po	84	209	531	126	73	60	49.5	41	21.2	19.0	8.63	5.42	2.65	6.40	2.19	
At	85	210	556	140	76	60	52	41.5	21.7	19.8	9.03	5.68	2.77	6.68	2.29	
Rm	86	222	551	60	80	59	53	42	22.2	20.6	8.95	5.64	2.74	6.59	2.26	
Fr	87	223	573	62	83	60	54	44	22.8	20.8	9.34	5.86	2.86	1.66	2.34	
Ra	\$8	226.025	591	65	87	6Z	55	46	23.5	21	9.61	6.05	2.93	1.71	2.41	
Ac	89	227.028	613	70	89	63	58	47	24.5	22	10.0	6.29	3.05	1.77	2.50	
Th	90	232.038	628	75	92	65	62	48	25.6	23	10.2	6.41	3.09	1.79	2.44	
Pa	91	231.036	662	\$0	95	67	61	48.5	26.2	24	10.8	6.75	3.27	1.89	2.67	
U	92	238.029	658	85	81	70	60	49	27	24.5	10.9	6.83	3.31	1.92	2.83	
Np	93	237.048	701	90	63	72	62	51	28	25	11.4	7.14	3.46	1.99	2.82	
Pu	94	239.13	717	95	63	75	63	53	29	26	11.6	7.27	3.51	2.02	2.71	
2		-														

Литература

 Cohen R.L. Experimental methods in Mossbauer spectroscopy / R.L Cohen, G.K. Wertheim // *Methods of Experimental Physics*, vol. 11. R.V. Coleman (Ed.), Academic Press. New York, 1974. - pp. 307-369.

2. Longworth G. Instrumentation for Mossbauer spectroscopy / G. Longworth // Advances in Mossbauer Spectroscopy: Applications to Physics, Chemistry and Biology,

B.V. Thosar and P.K. Iyengar (Eds.), Elsevier. Amsterdam, 1983. - pp. 122-158.

3. Shirley D.A. Recoil-free resonant absorption in Au¹⁹⁷/ D.A. Shirley, M. Kaplan, and P. Axel // *Phys. Rev.* 1961. - V.123. - pp.816-830.

4. Margulies S. Transmission and line broadening of resonance radiation incident on a resonance absorber / S. Margulies and J.R. Ehrman // *Nucl.Instrum.Methods*. 1961. – V.12.- pp.131-137.

5. Ruby S.L. Line shape in Mossbauer spectroscopy / S.L Ruby and J.M. Hicks // *Rev. Sci Instrum.* 1962. – V.33, - pp.27-30.

6. Shimony U. Condition for maximum single-line Mossbauer absorption / U. Shimony
// Nucl. Instrum. Methods. 1965. – V.37.- pp.348-350.

7. Blarney P.J. The area of a single line Mossbauer absorption spectrum / P.J. Blarney
 // Nucl. Instrum. Methods. 1977. - V.142. - pp.553-557.

8. Bancroft G.M. Mossbauer Spectroscopy / G.M. Bancroft // Mossbauer Spectroscopy: An Introduction for Inorganic Chemists and Geochemists, Wiley-New York. 1973. - p.252.

9. Weisman I.D. Nuclear resonances in metals: nuclear magnetic resonance and Mossbauer effect / I.D. Weisman, L.J. Swartzendruber and L.H. Bennett // *Measurement of Physical Properties*, Techniques of Metal Research.Vol. 6. Part 2, E. Passaglia (Ed.), Wiley, New York. 1973. - pp. 165-504. Sarma P.R. Optimization of the absorber thickness for improving the quality of a Mossbauer spectrum / P.R. Sarma. V. Prakash, and K.C. Tripathi // *Nucl. Instrum. Methods.* 1980. – V.178. – pp.167-171.

11. Long G.J. The ideal Mossbauer effect absorber thickness / G.J. Long, T.E.

Cranshaw, and G. Longworth // Mossbauer Effect Ref. Data J. 1983. - V.6. - pp. 42-49.

12. Kumar A. Optimized thickness of diffusive Mossbauer absorbers / A. Kumar. M.R.

Singh. P.R. Sarma. and K.C. Tripathi // J. Phys. D. 1989. - V.22. - pp.465-466.

13. Zhang F.L. Determination of the optimum thickness of an absorber in Mossbauer spectroscopy / F.L Zhang. F. Yi, Y.L Chen and B.F. Xu. // *J. Wuhan University (Natural Sci. Edition).* 1997. – V.43. – pp.348-352.

14. Вагизов Ф.Г. Процессы бесфононного излучения и поглощения гамма фотонов ядрами в твердых телах (теория и практика мессбауэровской спектроскопии) / Ф.Г. Вагизов, Э.К. Садыков // Учебно-методическое пособие для студентов третьего и четвертого курса, магистрантов и аспирантов Института физики. Казань. 2011, - 20 с. <u>http://kpfu.ru/docs/F22752037/02_vagizovfactorlm.pdf</u>